

连接器高低温老化试验

产品名称	连接器高低温老化试验
公司名称	深圳市华瑞测科技有限公司
价格	30.00/小时
规格参数	品牌:华瑞测分析 项目:可靠性高低温测试 产地:深圳
公司地址	中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号
联系电话	0755-23093158 13684912512

产品详情

高低温老化测试、温湿度循环老化测试、温度冲击老化测试、振动、机械冲击、跌落、防尘防水、高压清洗、按键疲劳和寿命测试，插拔疲劳和寿命等测试；

样品量：4套

周期：试验循环周期 结束后2天

耐候老化测试：紫外UV老化测试、氙灯老化测试、碳弧灯老化测试、卤素灯老化测试、橡胶臭氧老化测试、热空气老化测试、老化后色差/灰标评价、机械性能老化测试、老化前后硬度、强度测试、冲击测试、；

老化试验主要是指针对橡胶、塑料产品、电器绝缘材料及其他材料进行的热氧老化试验；或者针对电子零配件、塑化产品的换气老化试验。

老化试验又分为温度老化、阳光辐照老化、加载老化等等。

高温老化一般分几个等级进行,工业的一般用70度,4个小时,15度一个等级,一般有40度,55度70度,85度几个等级,时间一般都是4个小时。

根据老化试验产品的多少分为2种方法测试

1、老化箱；主要针对塑胶产品，而且数量和体积不很大的产品比较实用

2、老化柜或是老化房；主要针对高性能电子产品（如：计算机整机，显示器，终端机，车用电子产品，电源供应器，主机板、监视器、交换式充电器等）仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的主要生产流程，该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域

主要的老化试验项目是：

1、光老化测试+波长范围：氙弧灯老化（300-800nm）、紫外灯老化（280-400nm）、碳弧灯老化（300-700nm），金属卤素灯老化（280-3000nm）。

主要参考标准有：

氙弧灯老化：GB/T 16422.2(等同与GB/T4892.2)、GB/T 8427、GB/T 1865ASTM D4355、ASTM G155、JIS K5600等

紫外光老化：GB/T 16422.3(等同与GB/T4892.3)、GB/T 18950、ASTM G 154ASTM D-4674、ASTM_D4674、JIS K 7350 等

碳弧灯老化：GB/T 16422.3(等同与GB/T4892.3)、ASTM G153、JIS D 0205JIS B 7753等

金属卤素灯老化：GB 2423.24、IEC60068-2-5、DIN75520等

光老化是户外使用材料受到的主要老化破坏，对于室内使用材料，也会受到一定程度的光老化。模拟光老化主要的三种光源各有优异，碳弧灯发明使用，建立的测量体系较早、很多日本标准和纤维材料方面的标准都使用碳弧灯，但由于碳弧灯价格较高、性能不够稳定（灯管使用90小时后需要更换），已经逐渐被氙弧灯、紫外灯代替。氙灯在模拟自然光方面有较大优势，价格也相对较低，适合多数产品的使用。紫外灯产生的是400nm以下的光，能较好地加速模拟自然光中紫外线对材料的破坏作用，加速因子比氙灯要高，光源稳定性也比氙灯要好，但容易产生非自然光产出的破坏（尤其是UVB灯）。

主要应用范围：户外、室内使用的橡塑、涂料、油墨产品，通讯、电器等设备外壳，汽车件、摩托车配件。

2、热老化

主要参考标准：GB/T 7141、ASTM D3045、JIS K 6257等。

GB/T20028硫化橡胶或热塑性橡胶 应用阿累尼乌斯图推算寿命和使用温度。

众所周知，电子产品在生产出厂过程中，总有一个步骤是必不可少的，那就是高低温老化测试。那么，电子产品为什么要进行高低温老化测试呢？我相信这个问题很多人都有想过，那么今天就请跟随环境老化测试专家——深圳华瑞测实验室（高低温老化测试厂家）一起来探究一下吧。

随着电子技术的发展，电子产品的集成化程度越来越高，结构越来越细微，工序越来越多，制造工艺越来越复杂，这样在制造过程中会产生一些潜伏缺陷。电子产品在生产制造时,因设计不合理、原材料或工艺措施方面的原因引起产品的质量问题的质量问题概括有两类：

一类是产品的性能参数不达标，生产的产品不符合使用要求；

第二类是潜在的缺陷，这类缺陷不能用一般的测试手段发现，而需要在使用过程中逐渐地被暴露，如硅片表面污染、组织不稳定、焊接空洞、芯片和管壳热阻匹配不良等等。

一般这种缺陷需要在元器件工作于额定功率和正常工作温度下运行一千个小时左右才能全部被(暴露)。显然，对每只元器件测试一千个小时是不现实的，所以需要对其施加热应力和偏压，例如进行高温功率应力试验，来加速这类缺陷的提早暴露。也就是给电子产品施加热的、电的、机械的或多种综合的外部应力，模拟严酷工作环境，消除加工应力和残余溶剂等物质，使潜伏故障提前出现，尽快使产品通过失效浴盆特性初期阶段，进入高可靠的稳定期。

通过高温老化可以使元器件的缺陷、焊接和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露，老化后再进行电气参数测量，筛选剔除失效或变值的元器件，尽可能把产品的早期失效消灭在正常使用之用，从而保证出厂的产品能经得起时间的考验。

温湿度组合循环老化试验、交变湿热老化试验、恒定湿热老化试验、高低温度变化试验、恒温恒湿试验、高温试验、低温试验、

电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温GB/T 2423.1-2008

电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 IEC 60068-2-1：2007

军用设备环境试验方法 第4部分：低温试验 GJB 150.4A-2009

电连接器和插座低温测试程序 EIA-364-59A-2006(R2013)

电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：高温GB/T 2423.2-2008

电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温试验方法 IEC 60068-2-2 : 2007

军用设备环境试验方法 : 高温试验 GJB 150.3A-2009

电工电子产品环境试验 第2部分 : 试验方法 试验N : 温度变化GB/T 2423.22-2012

电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化IEC 60068-2-14 : 2009

军用设备环境试验方法 : 温度冲击 GJB 150.5A-2009

电工电子产品环境试验 第2部分 : 试验方法 试验Cab : 恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2006

电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法 IEC 60068-2-78 : 2012

电连接器和插座的湿度测试程序 EIA-364-31D-2014

色漆和清漆 耐湿性的测定连续冷凝法GB/T13893-2008

电工电子产品环境试验 第2部分 : 试验方法 试验Db : 交变湿热 (12h+12h循环) GB/T 2423.4-2008

电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热 (12h+12h循环) IEC 60068-2-30 : 2005

漆膜耐湿热测定法GB/T1740-2007

电工电子产品环境试验 第2部分 : 试验方法 试验ZAD : 温度湿度组合循环试验GB/T 2423.34-2012

电工电子产品环境试验 第2部分 : 试验方法 试验Z/AD : 温度/湿度组合循环试验 IEC 60068-2-38 : 2009

色漆和清漆 耐热性的测定GB/T 1735-2009

电连接器和插座的温度寿命测试 (带载或不带载) 程序

EIA-364-17C-2011电工电子产品环境试验 第2部分 : 试验方法 试验A : 低温GB/T 2423.1-2008

电连接器和插座的温度寿命测试（带载或不带载）程序EIA-364-17C-2011

华瑞测分析实验室专业电子产品高低温老化测试、高低温循环老化测试、恒温恒湿老化测试、高低温冲击老化测试、紫外光老化测试等各种电子产品专用环境老化测试服务，通过多年的不断努力与客户的支持与信赖，试验已经应用于：航空、航天、IT、通讯、电器、汽车、化工、塑胶、橡胶、塑料、金属、建筑、电线电缆、皮革、纺织、机械、箱包、印刷及其高等院校等各大领域。技术、品质、服务快捷到位，如有需求，敬请与我们通电，期待您的来电！